

低電流耐久試験装置

システム概要

本システムは、デバイスの特性検査およびバーンインソケット等に使用されるコンタクトの寿命特性を評価するための装置です。

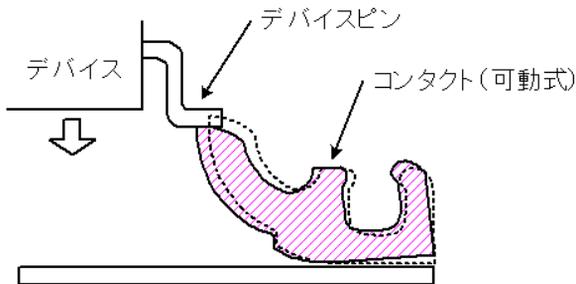
機能紹介

● 耐久性評価機能

実際のユーザーが検査に使用している環境を模し、垂直可動のロボットによるコンタクトの耐久試験を実施できます。（最大1000万回）

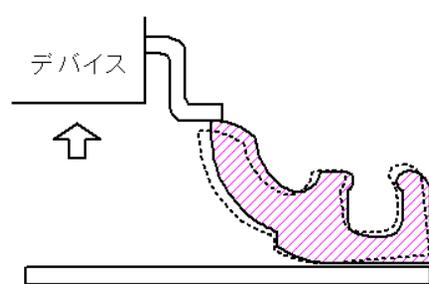
実際のデバイスを使用した場合

デバイス取り付け動作



デバイスピンによる圧力で
コンタクトが下方向に押し込まれる

デバイス取り外し動作

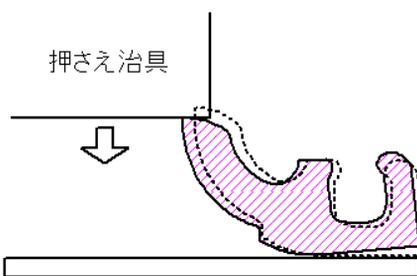


デバイスピンによる圧力から
コンタクトが解放される

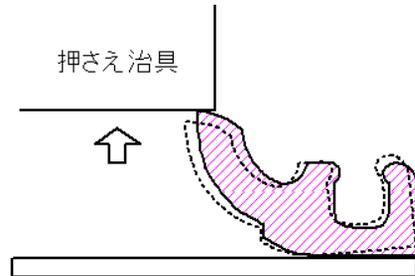
治具とロボットによる模擬動作

デバイスの取り付け・取り外しを模した動作を押さえ治具とロボットで実現

取り付け動作



取り外し動作



押さえ治具の上下動作を連続的にロボットで制御（最大1000万回繰返し可能）

機能

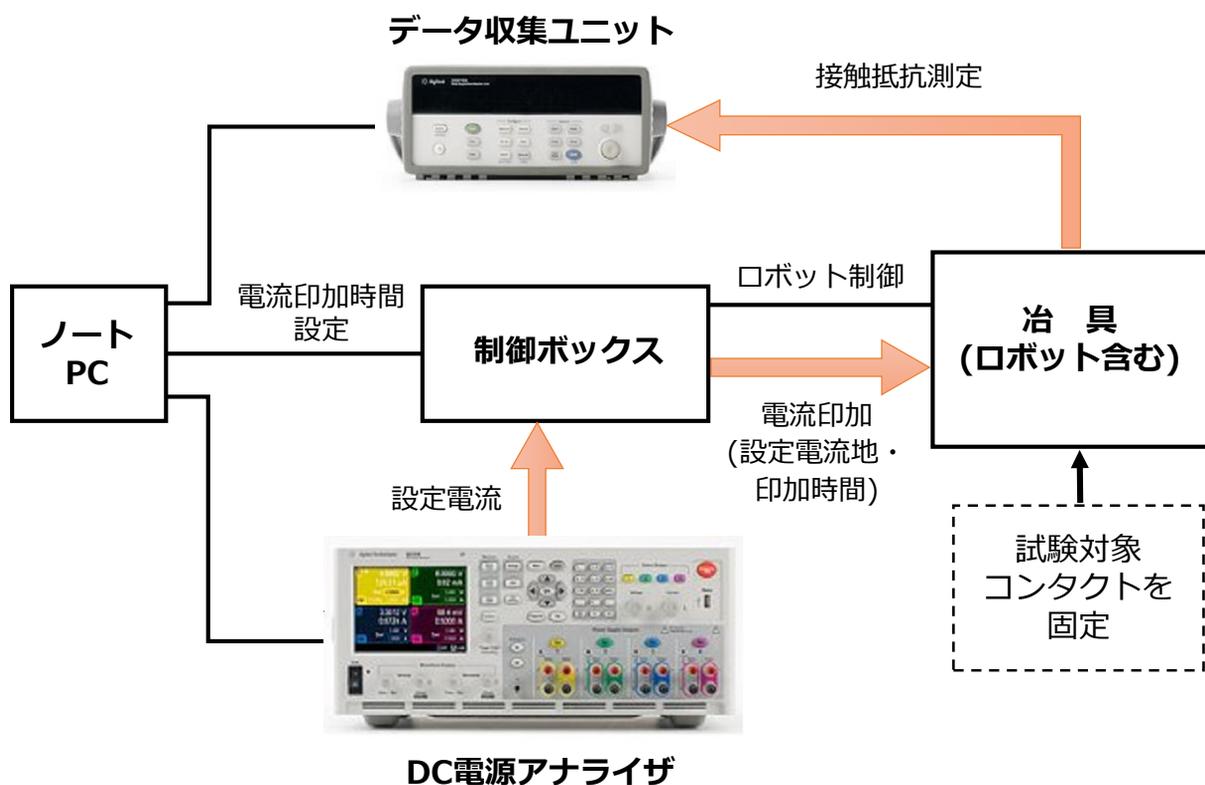
●電流印加機能

デバイスの機能試験を想定したコンタクトへの通電を実行しながら試験を実施できます。印加電流及び電流印加時間の設定が可能です。(印加電流100mA~50A、電流印加時間10uS~500mS)

●接触抵抗測定機能

試験中のコンタクトの接触抵抗が測定可能です。

システムブロック図



QUALITY & KINDNESS
QK 九州計測器株式会社

本社 : 〒812-0015 福岡市博多区山王1丁目6-18
TEL : 092-441-3200
FAX : 092-441-3264
Web : <http://www.qk-net.co.jp>